

P14-2007-12

Т. Н. Мамедов¹, А. С. Батурина², В. Д. Бланк³, Д. Герлах⁴,
В. Н. Горелкин², К. И. Грицай¹, В. А. Жуков¹,
М. С. Кузнецов³, С. А. Носухин³, А. В. Стойков^{1, 4},
С. А. Терентьев³, У. Циммерманн⁴

ИССЛЕДОВАНИЕ АКЦЕПТОРНОЙ ПРИМЕСИ БОРА
В ИСКУССТВЕННОМ АЛМАЗЕ μ^- SR-МЕТОДОМ

Направлено в «Журнал экспериментальной и теоретической физики»

¹Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

²Московский физико-технический институт, Долгопрудный,
Московская обл.

³Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных
материалов, Троицк, Московская обл.

⁴Paul Scherrer Institut, CH-5232 Villigen PSI, Switzerland

Мамедов Т. Н. и др.

P14-2007-12

Исследование акцепторной примеси бора в искусственном алмазе
 μ^- SR-методом

Представлены результаты исследования поведения акцепторной примеси бора в искусственном алмазе μ^- SR-методом. Были исследованы образцы IIa и IIb типов. Атомы акцепторной примеси μ B в образце создавались путем имплантации отрицательных мюонов. Поляризация мюонов была исследована в поперечном спину мюона магнитном поле величиной 2,5 кГс в диапазоне температур 4,2–300 К.

Обнаружено, что акцепторный центр μ B в алмазе образуется в основном в диамагнитном (ионизованном) состоянии. Определена скорость захвата дырки на ионизированный акцепторный центр в IIa и IIb типах алмаза в области температур выше 80 и 50 К соответственно.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 2006

Mamedov T. N. et al.

P14-2007-12

Investigation of the Boron Acceptor Impurity in a Synthetic Diamond
by the μ^- SR-method

The results in the investigation of boron acceptor centers in a synthetic diamond by the μ^- SR-method are presented. Two IIa and IIb type monocrystal samples were studied. Atoms of μ B-acceptor impurity in the sample were created by implantation of negative muons. The polarization of muons was studied in a magnetic field of 2.5 kG transverse to the direction of the muon spin in the temperature range 4.2–300 K.

It was found that μ B acceptor in a diamond is formed mostly in diamagnetic (ionized) state. The hole capture rate by an ionized acceptor center in IIa and IIb types of a synthetic diamond was found at temperatures $T > 80$ K and $T > 50$ K respectively.

The investigation has been performed at the Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 2006

ВВЕДЕНИЕ

Алмаз, как полупроводник, обладающий высокой механической прочностью, теплопроводностью и радиационной устойчивостью, давно привлекает к себе внимание с точки зрения изготовления на его основе детекторов ядерного излучения и элементов твердотельной электроники, способных работать в условиях сильных радиационных и тепловых нагрузок (см., например, [1]). Существенный прогресс [2, 3], достигнутый в последние годы в технологии получения высококачественных поли- и монокристаллических пленок искусственного алмаза толщиной 200–300 мкм и более, делает реальным создание в ближайшие годы на основе алмаза детекторов ядерного изучения и элементов электроники.

Основными электрически активными примесями в алмазе являются атомы азота и бора [1, 4, 5]. Однако атомы азота в алмазе образуют очень глубокие донорные уровни ($E_c = 1,7$ и $4,0$ эВ при ширине запрещенной зоны $E_g = 5,4$ эВ), и поэтому применение алмаза с примесью азота в электронных устройствах затруднено. Замещающие атомы бора в решетке алмаза образуют относительно неглубокие акцепторные центры ($E_v = 0,37$ эВ [6, 7]). Растворимость атомов бора в алмазе достаточно высокая ($\sim 10^{21}$ см $^{-3}$), и критическая концентрация, соответствующая переходу полупроводник–металл, составляет около $n_c = 2 \cdot 10^{20}$ см $^{-3}$ [4, 8]. Время жизни неравновесных носителей заряда в природном алмазе составляет не более 10^{-8} с (см., например, [1]).

Как и в других полупроводниках с кристаллической структурой алмаза, ЭПР-сигнал акцепторных примесей в алмазе был наблюден лишь в деформированных образцах [9]. При этом резонансная линия настолько широкая, что сверхтонкая структура не наблюдается, и, соответственно, из этих данных определение константы сверхтонкого взаимодействия акцепторного центра не представляется возможным.

Результаты, достигнутые в изучении взаимодействия акцепторной примеси алюминия в решетке кремния с использованием пучков поляризованных отрицательных мюонов [10–13], дают достаточные основания полагать, что применение данного метода позволит хотя бы частично заполнить пробел, имеющийся в настоящее время в экспериментальном исследовании акцепторной примеси бора в алмазе. Возможность использования поляризованных отрицательных мюонов для исследования взаимодействий акцепторной примеси в алмазе обусловлена тем, что при захвате мюона атомом углерода образовавшийся мюонный атом $_{\mu}B$, с точки зрения строения его электронной

оболочки, имитирует атом бора. При этом поляризация мюона определяется состоянием электронной оболочки (парамагнитным или диамагнитным) мюонного атома — акцепторного центра (АЦ), сверхтонким взаимодействием в АЦ и взаимодействиями АЦ со средой. Соответственно, исследуя временную эволюцию поляризации мюонов, остановившихся в алмазе, можно получить информацию о взаимодействиях акцепторной примеси бора в кристаллической решетке алмаза.

В невырожденном алмазе основным состоянием акцепторного центра бора является парамагнитное состояние с эффективным моментом $j = 3/2$, а уровень с $j = 1/2$ расположен на величину $\Delta = 2,07$ мэВ выше, чем уровень $j = 3/2$ [14]. Взаимодействие с фононами в кристалле приводит к релаксации магнитного момента акцепторного центра. При этом поведение поляризации мюона в АЦ μB зависит от соотношения скорости релаксации магнитного момента акцепторного центра ν и константы сверхтонкого взаимодействия мюона с электронной оболочкой данного центра A_{hf} . Согласно теоретическим расчетам [15], при $\nu \gg A_{\text{hf}}$ ожидается релаксация спина мюона и парамагнитный сдвиг частоты прецессии спина мюона в магнитном поле.

Временная зависимость поляризации мюона в случае $\nu \gg A_{\text{hf}}$ может быть получена решением следующей системы дифференциальных уравнений [10]:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}p_1 &= (i\omega_1 - r_{12})p_1 + r_{21}p_2, \\ \frac{d}{dt}p_2 &= r_{12}p_1 + (i\omega_2 - \lambda - r_{21})p_2, \end{aligned} \quad (1)$$

где $p_j = P_j^x \cos(\omega_j t) + iP_j^y \sin(\omega_j t)$ — проекция поляризации мюона в плоскости, перпендикулярной направлению магнитного поля; ω_j — частота прецессии спина мюона в магнитном поле; r_{12} и r_{21} — скорости перехода из состояния 1 в состояние 2 и из 2 в 1 соответственно; λ — скорость релаксации спина мюона в парамагнитном центре μB . Индексы 1 и 2 соответствуют диамагнитному и парамагнитному состояниям акцептора μB .

1. ИЗМЕРЕНИЯ

Измерения были выполнены на спектрометре GPD [16], расположенным на мюонном канале $\mu\text{E}1$ ускорителя протонов Института Пауля Шеррера (PSI, Швейцария). Перпендикулярное к направлению вектора начальной поляризации спина мюона однородное магнитное поле на образце создавалось кольцами Гельмгольца. Величина магнитного поля составляла 2,5 кГс с долговременной стабильностью не хуже чем 10^{-4} . Измерения проводились в криостате, продуваемомарами гелия, что позволяло изменять температуру

образца в диапазоне 4,2–300 К. Температура образца стабилизировалась с точностью не хуже чем 0,1 К.

В измерениях были использованы два образца (обозначаемые далее как D3 и D4), составленные из нескольких монокристаллов алмаза. Вес каждого образца ~ 2 г. Размер отдельных кристаллов составлял 1–4 мм. Образец D3 — IIa типа (бесцветный, прозрачный) — содержал примесь азота около 0,5 ppm (1 ppm соответствует концентрации $1,76 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$). Второй образец D4 — IIb типа (голубого цвета, прозрачный) — был допирован бором. Концентрации азота и бора в нем составляли 0,5 и 1,5 ppm соответственно. В обоих образцах заметна в виде темных включений примесь никеля, используемого как катализатор в процессе синтеза. Кристаллы алмаза были получены методом спонтанного синтеза при высоких давлениях и температуре (НРНТ) в Технологическом институте сверхтвердых и новых углеродных материалов. Ранее нами были исследованы также два других образца алмаза: D1 и D2 [17, 18]. Образец D1, полученный методом НРНТ [19], состоял из кристаллов черного цвета размером 120–180 мкм и содержал примеси азота, алюминия, марганца, железа и никеля до 0,1%. Образец D2 с общим весом ~ 2 г был составлен из алмазных пленок с размерами $\lesssim 20 \times 20 \times 0,4$ мм. Пленки алмаза были получены методом химического осаждения (CVD-метод) из паров смеси CH_4/H_2 [20]. При этом основными примесями в образце были водород (75–300 ppm) и азот (0,4–10 ppm). Другие примеси составляли менее 0,1 ppm. Размеры кристаллитов в плоскости пленки находились в интервале 70–120 мкм. Ось кристаллитов $\langle 110 \rangle$ была перпендикулярна к поверхности пленок. Известно также, что кристаллиты в пленке являются напряженными, причем напряжение возрастает к границам зерен и может достигать величины, соответствующей давлению десятков кбар [21].

Временная эволюция поляризации мюонов $P_i^x(t)$ (далее индекс x опущен), остановившихся в образце, исследовалась путем измерения временного распределения электронов из реакции $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, вылетающих по направлению x , перпендикулярному внешнему магнитному полю. С учетом решений уравнений (1) зависимость количества зарегистрированных электронов от времени (по отношению к времени остановки мюонов в образце) имеет следующий общий вид:

$$N(t) = N_0 \exp(-t/\tau_\mu) \left(1 + \frac{1}{3} \sum_{i=1}^2 P_i(t) \cos(\omega_i t + \varphi_i) \right) + \text{Bg}, \quad (2)$$

где N_0 — величина, определяемая количеством остановок мюонов в образце; Bg — случайный фон, не связанный с распадом остановившихся в образце мюонов; τ_μ — время жизни мюона на $1s$ -уровне в атоме; φ_i — фаза прецессии спина мюона в магнитном поле.

В рамках настоящей работы мы не будем обсуждать методику измерений и процедуру восстановления функции поляризации спина мюона $P_i(t)$ из аппаратурных μ^- SR-спектров. Эти вопросы подробно рассмотрены в работах [10, 11].

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 1 в качестве примера представлен аппаратурный спектр в интервале времени 0–1 мкс, соответствующий остановкам отрицательных мюонов в искусственном алмазе IIb типа при 240 К. Полный диапазон измерений составляет 10 мкс. Для наглядности фон вычен, и данные поправлены на множитель $N_0 \exp(-t/\tau_\mu)$. Ввиду того, что в исследованных образцах прецессия спина мюона наблюдалась только на одной частоте, далее в тексте индексы i опущены. Как видно из рис. 1, в начальный момент времени величина $P(t)/3$ близка к 0,05, что примерно соответствует ожидаемому максимальному значению поляризации мюона на 1s-уровне в углероде. Очевидно, что имеет место уменьшение поляризации мюона во времени.

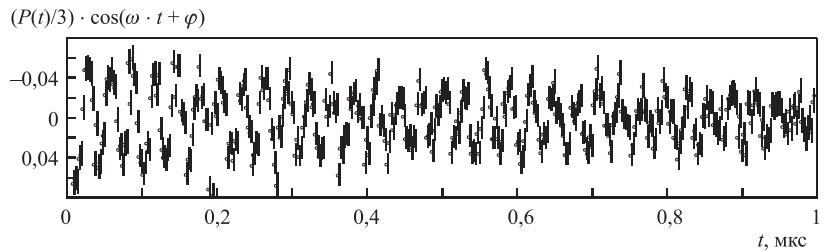


Рис. 1. Аппаратурный спектр после вычитания фона и введения поправки на экспоненту с характерным временем жизни мюона на 1s-уровне в углероде для искусственного алмаза IIb типа при 240 К

Экспериментальные данные были аппроксимированы функцией (2) в предположении, что $P(t) = P(T, t) = P_0(T) \exp(-R(T)t)$. Полученные результаты по температурной зависимости величины поляризации в начальный момент времени $P_0(T)$ по отношению к $P_0(300)$ и скорости потери поляризации мюона $R(T)$ для образцов D3 и D4 представлены на рис. 2 и 3 соответственно. На рис. 3 для сравнения приведены также измеренные ранее данные для CVD-алмаза [18].

Как видно из рис. 2 и 3, скорости уменьшения поляризации во времени R в образцах D2, D3 и D4 существенно отличаются. Для каждого образца имеется определенный интервал температур, в котором наблюдается степенная

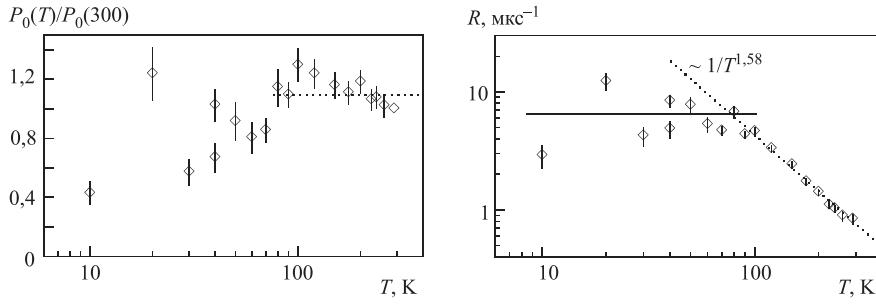


Рис. 2. Температурные зависимости начальной поляризации спина мюона $P_0(T)/P_0(300)$ и скорости ее уменьшения R в искусственном алмазе IIa типа (образец D3). Горизонтальные линии проведены для наглядности. Наклонная линия соответствует минимуму χ^2 при аппроксимации экспериментальных данных степенной зависимостью от температуры при $T > 80$ К

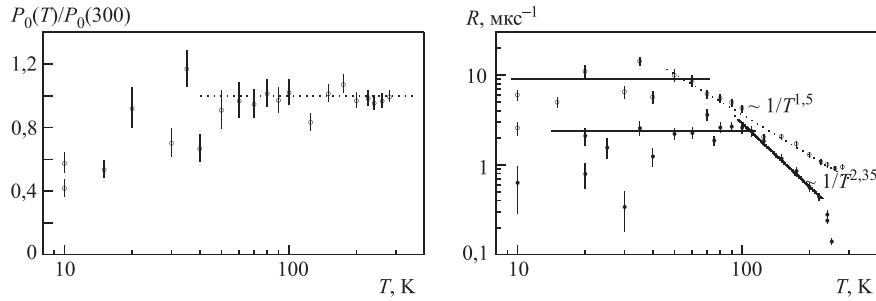


Рис. 3. Температурные зависимости $P_0(T)/P_0(300)$ начальной поляризации спина мюона и скорости ее уменьшения R в искусственном алмазе IIb типа (\circ — образец D4) и в CVD-алмазе (\bullet — образец 2) [18]. Горизонтальные линии проведены для наглядности. Наклонные линии соответствуют минимуму χ^2 при аппроксимации экспериментальных данных зависимостью $R \sim T^{-\alpha}$

зависимость R от T . Значение параметра α , полученное при аппроксимации экспериментальных данных зависимостью $R = C \cdot T^{-\alpha}$, максимальное значение R_{\max} , интервал температур ΔT , в котором проводилась аппроксимация данных и температура T_0 , выше которой наблюдается степенная зависимость R от T , приведены в таблице. При температурах $T \geq T_0$ значения $P_0(T)$ в пределах погрешности измерений не зависят от температуры и близки к величине в графите. В области $T \leq T_0$ наблюдаются нерегулярности в температурных зависимостях $P_0(T)$ и $R(T)$. Однако при температурах $T \leq T_0$ имеет место сильная корреляция между параметрами $P_0(T)$ и $R(T)$ (см. рис. 2 и 3). Соответственно, в данной области температур нахождение

значений $P_0(T)$ и $R(T)$ из одних и тех же экспериментальных данных при имеющейся статистике может оказаться некорректным. Например, значение χ^2 при фитировании экспериментальных данных для образцов D3 и D4 с фиксированным значением $P_0(T) = P_0(T = 300 \text{ K})$ практически не отличается от случая, когда $P_0(T)$ и $R(T)$ принимались как свободно варьируемые параметры. Следует отметить, что при $P_0(T) = P_0(T = 300 \text{ K})$ полученные значения $R(T < T_0)$ для D3 и D4 практически не зависят от температуры и по величине близки к R_{\max} , приведенным в таблице для соответствующего образца.

Значения параметра α в зависимости $R \sim T^{-\alpha}$

| Образец | $T_0, \text{ K}$ | $\Delta T, \text{ K}$ | α | $R_{\max}, \text{ мкс}^{-1}$ |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| D2 | 100 | 100–220 | $2,35 \pm 0,08$ | 2,4 |
| D3 | 80 | 80–300 | $1,58 \pm 0,07$ | 6,5 |
| D4 | 50 | 50–280 | $1,50 \pm 0,08$ | 10,0 |

Значения R (в интервале 80–280 К) и параметра α для кристаллических образцов D3 и D4 близки друг к другу и существенно отличаются от их величины для алмазной пленки (образец D2). Значение T_0 , выше которой наблюдается степенная зависимость R от температуры, уменьшается от образца к образцу в порядке следования D2:D3:D4 как 100:80:50 К.

Что касается образца D1 с высокой концентрацией примеси и дефектов, то из прежних измерений следует [17], что $R(T)$ меняется в незначительных пределах 0,2–0,35 мкс⁻¹, а $P_0(T)/P_0(300)$ растет от 0,4 при $T = 6 \text{ K}$ до единицы при 300 К.

3. ОБСУЖДЕНИЕ

Как было отмечено выше, в случае формирования АЦ _{μ} В в парамагнитном состоянии в алмазе должен иметь место сдвиг частоты прецессии спина мюона в магнитном поле. Однако в образцах алмаза во всем диапазоне температур частота прецессии спина мюона во внешнем магнитном поле совпадает с частотой прецессии в графите с точностью $5 \cdot 10^{-4}$. Например, в кремнии в диапазоне 6–55 К парамагнитный сдвиг частоты $\Delta\omega/\omega$ меняется от 10^{-2} до 10^{-3} , и его температурная зависимость соответствует закону Кюри [10–13]. В случае алмаза парамагнитный сдвиг частоты прецессии спина должен был бы быть в несколько раз больше, чем в кремнии, поскольку боровский радиус акцепторного центра в алмазе примерно в два раза меньше, чем в кремнии.

Совпадение частоты прецессии спина мюона в алмазе с ее значением в графите свидетельствует о том, что в эксперименте наблюдается лишь поляризация мюона на акцепторном центре μB , находящемся в диамагнитном (ионизованном) состоянии. Соответственно при $T > T_0$ мюонный атом (акцепторный центр) за время $\lesssim 10^{-9}$ с вероятностью, близкой к единице, образуется в диамагнитном состоянии (μB^-). Уменьшение же поляризации во времени при $T > T_0$ обусловлено захватом дырок со скоростью R на ионизированный (диамагнитный) акцепторный центр. Таким образом, экспериментально найденная величина R соответствует r_{12} в уравнениях (1).

Как видно из рис. 2 и 3, для образцов D3 и D4 при $T < 40$ К имеется указание на уменьшение $P_0(T)$. Соответственно, не исключено, что в образцах D3 и D4 при $T < 40$ К вероятность образования парамагнитного состояния (μB^0) за время $\lesssim 10^{-9}$ с существенно отличается от нуля, и парамагнитная фракция (далее: недостающая фракция) поляризации экспериментально не наблюдается. Заметная недостающая фракция поляризации мюона наблюдалась в образце D1 при $T \leq 200$ К [17] и в образце D2 при $T \leq 60$ К [18].

Парамагнитная фракция поляризации мюона в условиях настоящего эксперимента могла быть не наблюдена по следующим причинам:

- a) $A_{\text{hf}}/h \gg \nu$, то есть константа сверхтонкого взаимодействия магнитных моментов мюона и акцепторного центра A_{hf}/h значительно больше скорости релаксации магнитного момента акцепторного центра ν . При этом прецессия полного магнитного момента (мюона и незаполненной электронной оболочки атома) μB в магнитном поле 2500 Э происходит на частоте Ω , которая примерно в сто раз превосходит частоту прецессии спина свободного мюона. Однако в пределах разрешения аппаратуры прецессия на частоте Ω не могла быть обнаружена. Следует отметить, что при $A_{\text{hf}}/h \gg \nu$ в отсутствие магнитного поля в алмазе при $\ll \Delta/k \simeq 24$ К (k — постоянная Больцмана) должна наблюдаться осцилляция поляризации мюона на частоте A_{hf}/h .
- б) $A_{\text{hf}}/h < \nu$, но имеет место быстрая деполяризация мюона в парамагнитном акцепторном центре.

При $A_{\text{hf}}/h < \nu$ из решений уравнений (1) следует, что если АЦ μB за время $\lesssim 10^{-9}$ с с определенной вероятностью формируется в диамагнитном и парамагнитном состояниях или он формируется в диамагнитном состоянии и имеет место переход в парамагнитное состояние, поляризация мюона как функция времени должна иметь две компоненты с различными частотами прецессии спина мюона в магнитном поле. При этом парамагнитная фракция поляризации может быть экспериментально не обнаружена, если имеет место деполяризация мюона в парамагнитном состоянии со скоростью $\geq 10^{-8}$ с⁻¹.

С целью поиска осцилляции поляризации мюона было проведено измерение в образце D4 при 4,5 К в отсутствие внешнего магнитного поля. Осцилляция поляризации мюона на частотах менее 400 МГц не обнаружена. Соответственно надо допускать, что либо $A_{hf}/h > 400$ МГц, либо имеет место случай $A_{hf}/h < \nu$. Простые оценки величины A_{hf}/h не позволяют исключить случай $A_{hf}/h > 400$ МГц для акцепторного центра ${}_\mu B^0$ в алмазе. Таким образом, исключить одну из рассмотренных выше причин отсутствия парамагнитной фракции поляризации в настоящее время не представляется возможным.

Для выяснения деталей взаимодействий акцепторного центра ${}_\mu B^0$ в алмазе необходимо принимать во внимание степень совершенства образцов (кристалл, пленка, поликристалл, наличие дефектов), радиолиз среды при торможении мюона и в процессе формирования мюонного атома. Хотя в настоящее время мы не имеем количественных данных о концентрации ловушек и других дефектов в образцах, корреляция величин R , α и T_0 со степенью совершенства образцов кажется очевидной.

Выше уже отмечалось качественное различие исследуемых образцов. То обстоятельство, что образцы D3 и D4 прозрачны, является свидетельством качества этих кристаллов. Естественно допустить, что они содержат наименьшее количество ловушек носителей заряда. (Влияние ловушек на проводимость в алмазе было наблюдено, например, в работе [22].) По содержанию примесей и дефектов пленки алмаза (образец D2) менее совершенны, чем кристаллы D3 и D4, а в образце D1 концентрация дефектов и, соответственно, ловушек для свободных носителей зарядов наибольшая. Причем ловушки могут иметь разные глубины. Образец D4 допирован бором, и концентрация примеси бора превосходит концентрацию азота, то есть в образце в равновесном состоянии имеется около $2 \cdot 10^{17}$ см⁻³ локализованных дырок с энергией связи 0,36 эВ. При учете таких оценок качества образцов из таблицы видно, что чем совершеннее образец как кристалл, тем а) меньше температура, ниже которой наблюдается недостающая поляризация; б) меньше температура, выше которой наблюдается степенная зависимость скорости потери поляризации R ; в) выше R .

При торможении мюона и при формировании мюонного атома возникает зона радиолиза среды вокруг мюонного атома. Как показывают расчеты [23], размер зоны радиолиза, где имеются неравновесные дырки и электроны, составляет около 10^{-4} см. В этих условиях вероятность образования акцепторного центра в парамагнитном или диамагнитном состояниях зависит от концентрации и подвижности свободных носителей заряда и от того, что к моменту термализации носителей заряда в зоне радиолиза какая-то часть их окажется захвачена ловушками.

В работе [24] показано, что сечение захвата σ свободного носителя на изолированный кулоновский центр в полупроводниках определяется следую-

щей формулой:

$$\sigma = \frac{4\pi}{3l_0} \frac{e^2}{\varepsilon kT} \left(\frac{e^2}{\varepsilon (kT + 2,74ms^2)} \right)^2, \quad (3)$$

где e — элементарный заряд; m — эффективная масса носителя (в нашем случае $0,7 \cdot m_e$ для дырки в алмазе); m_e — масса свободного электрона; s — скорость звука в среде (для алмаза $1,86 \cdot 10^6$ см/с при 300 К); T — температура среды; k — постоянная Больцмана; ε — диэлектрическая проницаемость среды; l_0 — длина потери энергии (оценка для алмаза 10^{-4} см).

Скорость захвата R дырки на ионизованный акцепторный центр может быть определена как

$$R = n\sigma \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}, \quad (4)$$

где n — концентрация дырок.

Для того чтобы обеспечить грубое согласие вычисленного значения R с экспериментальными данными (см. рис. 4) в области температур 70–150 К, требуется предположить, что в окрестности акцепторного центра имеются неравновесные дырки с концентрацией около $9 \cdot 10^{11}$ см $^{-3}$, которые образовались в процессе торможения и захвата отрицательного мюона и не успели рекомбинироваться к моменту наблюдения. При более высоких температурах (выше 150 К) следует дополнительно учитывать появление свободных равновесных дырок, связанных с ионизацией примеси бора, поэтому экспериментальные точки для образца D4 (IIb) на графике лежат выше теоретической кривой.

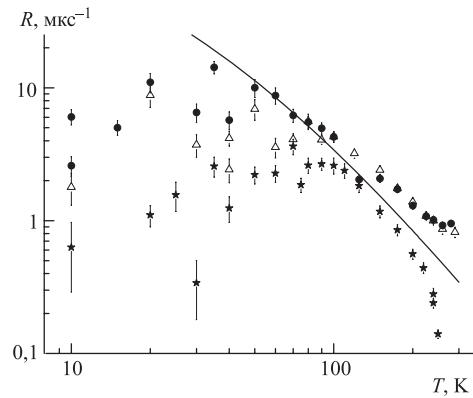


Рис. 4. Зависимость скорости уменьшения поляризации от температуры для образцов D2 (* — CVD-алмаз), D3 (Δ — тип IIa), D4 (● — тип IIb). Сплошная кривая соответствует расчету по формуле (4) при $n = 9 \cdot 10^{11}$ см $^{-3}$

Приведенные выше оценки не проясняют, однако, почему при высоких температурах практически нет разницы в скорости захвата дырки между образцами D4 (IIb) и D3 (Ia), в то время как в последнем отсутствует примесь бора.

Поскольку в случае образцов D3 и D4 требуется уточнение и увеличение количества экспериментальных данных при температурах ниже T_0 , пока воздержимся от обсуждения полученных в этой области результатов. Лишь отметим, что помимо наблюдаемой корреляции значений T_0 с качеством образцов, возможно, в области температур $T \lesssim 50$ К проявляется влияние эффекта абсолютно отрицательной проводимости в полупроводниках (см., например, [25, 26]), поскольку в момент формирования АЦ μ В в среде возникают неравновесные носители заряда (электроны и дырки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для монокристаллического алмаза в температурных зависимостях поляризации мюона и скорости ее релаксации в акцепторном центре μ В можно выделить две области: низкотемпературную и высокотемпературную. В высокотемпературной области акцепторный центр с вероятностью, близкой к единице, образуется в диамагнитном состоянии, и дальнейшее уменьшение поляризации во времени обусловлено захватом дырки на акцепторный центр. Экспериментально определена скорость захвата дырок на акцепторный центр в алмазе, температурная зависимость которой хорошо аппроксимируется в высокотемпературной области функцией вида $R = C \cdot T^{-\alpha}$. Кроме этого, установлено, что значение температуры T_0 , соответствующей границе между высоко- и низкотемпературной областями, уменьшается по мере снижения дефектности образца.

Теоретические оценки скорости захвата дырки на ионизированный акцепторный центр находятся в качественном соответствии с экспериментальными данными при температурах $T > T_0$. Дальнейшие детальные μ SR-исследования в алмазе при температурах $T < 50$ К представляют интерес, в том числе для экспериментального изучения эффекта абсолютно отрицательной проводимости в полупроводниках.

Настоящая работа была частично поддержана Министерством образования и науки РФ (грант РНП.2.1.1.9451).

Авторы благодарны дирекции Института Пауля Шеррера (Швейцария) за предоставление возможности проведения настоящих измерений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вавилов В. С. //УФН. 1997. Т. 167. С. 17.
2. Isberg J. et al. //Science. 2002. V. 297. P. 1670.
3. Adam W. et al. //NIM A. 2003. V. 514. P. 79.
4. Collins A. T. //Ceramics International. 1996. V. 22. P. 321.
5. Chrenko R. M. //Phys. Rev. B. 1973. V. 7. P. 4560.
6. Безруков Г. Н. и др. //Физика и техника полупроводников. 1970. Т. 4. С. 693; Sov. Phys. Semicond. 1970. V. 4. P. 58.
7. Collins A. T., Williams A. W. S. //J. Phys. C. 1971. V. 4, № 13. P. 1789.
8. Williams A. W. S., Lightowers E. C., Collins A. T. //J. Phys. C. 1970. V. 3. P. 1727.
9. Ammerlaan C. A. J. //Inst. Phys. Conf. Series 59. 1980. V. 81.
10. Mamedov T. N. et al. //J. Phys.: Condens. Matter. 1999. V. 11. P. 2849.
11. Мамедов Т. Н. Стойков А. В., Горелкин В. Н. //ЭЧАЯ. 2002. Т. 33, вып. 4. С. 1005.
12. Mamedov T. N. et al. //Physica B. 2003. V. 326, № 1-4. P. 97.
13. Мамедов Т. Н. и др. //Письма в ЖЭТФ. 2004. Т. 79. С. 25.
14. Kim H. et al. //Phys. Rev. B. 1998. V. 57. P. 15315.
15. Gorelkin V. N., Mamedov T. N., Baturin A. S. //Physica B. 2000. V. 289–290. P. 585.
16. Abela R. et al. //Hyp. Int. 1994. V. 87. P. 1105.
17. Мамедов Т. Н. и др. Сообщение ОИЯИ Р14-2004-104. Дубна, 2004.
18. Mamedov T. N. et al. //Physica B. 2006. V. 374. P. 390.
19. Шипило В. Б., Звонарев Е. В., Кузей А. М. и др. Получение, свойства и применение порошков алмаза и нитрида бора. Минск: Белорусская наука, 2003.
20. Ralchenko V. G., Smolin A. A., Kononov V. I. et al. //Diamond and Relat. Mater. 1997. V. 6. P. 417.
21. Vlasov I. I., Ralchenko V. G., Obraztsova E. D. et al. //Thin Solid Films. 1997. V. 308-309. P. 168.
22. Borchi E. et al. //Phys. Rev. B. 2005. V. 71. P. 104103.
23. Gorelkin V. N., Mamedov T. N., Rubtsov D. V. //Hyp. Int. C. 1996. V. 1. P. 191.
24. Абакумов В. Н., Перель В. И., Яссиеевич И. Н. //ФТП. 1978. Т. 12. С. 3.
25. Елесин В. Ф. //УФН. 2005. Т. 175. С. 197.
26. Baturin A. S. et al. //Physica B. 2006. V. 374-375. P. 340.

Получено 30 января 2007 г.

Редактор *М. И. Зарубина*

Подписано в печать 07.03.2007.

Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 1,08. Тираж 300 экз. Заказ № 55686.

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований
141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Жолио-Кюри, 6.
E-mail: publish@jinr.ru
www.jinr.ru/publish/